

第6回講習会

「X線反射率による薄膜・多層膜の解析」

2016年8月25日(木) 9:00~16:30

物質・材料研究機構 千現地区 (茨城県つくば市)

主催 (公社)応用物理学会 埋もれた界面のX線中性子解析研究会
<http://www.nims.go.jp/xray/ref/>

X線反射率法は、薄膜・多層膜の深さ方向の内部構造、具体的には、各層の膜厚、密度、各界面のラフネス等を非破壊的に求めることができる解析技術です。本講習会では、X線反射率法の経験豊富な専門家を講師陣に迎え、基礎から丁寧に解説を行うとともにシミュレーションやデータ解析の実習を少人数のグループにて、きめ細かく行ないます。休憩時間には「X線反射率相談デスク」を設け、日頃の疑問に思っていること、質問したくてもなかなかできなかったことに、6名の専門家がお答えします。

08:40	開場、受付開始	
09:00 -09:40	X線反射率法とは	桜井健次(物材機構)
09:40 -10:20	X線反射率実験の注意事項	表和彦(リガク)
10:20 -10:30	休憩	
10:30 -12:00	X線反射率法のシミュレーション・データ解析実習(A,B,Cコース)	
12:00 -13:00	昼食休憩 (12:30-13:00 X線反射率相談デスク、6箇所設置)	
13:00 -13:40	X線反射率法のシミュレーション・データ解析実習(A,B,Cコース)	
13:40 -14:10	X線反射率データ例① 半導体薄膜	淡路直樹(富士通)
14:10 -14:40	X線反射率データ例② 磁性体多層膜	上田和浩(日立)
14:40 -15:00	X線反射率データ例③ ナノドット	奥田浩司(京大)
15:00 -15:10	休憩	
15:10 -15:30	X線反射率データ例④ ガラス転移・接着界面	桜井健次(物材機構)
15:30 -16:00	X線反射率データ例⑤ 先端電子材料	川村朋晃(日亜化学)
16:00 -16:30	X線反射率相談デスク(6か所設置)	

「X線反射率法入門」(講談社、5940円)を参考書として配布するほか(ご希望があれば、着払い宅急便にて事前送付も致します)、すべての講義に完全対応したレジュメを用意いたします。

実習は、A.実践コース(6名まで 数年以上の経験のある方向け 担当 表和彦)、B.体験コース(12名まで 初心者もしくは経験1~2年の方向け 担当 淡路直樹)、C.実演見学コース(12名まで 初心者もしくは経験1~2年の方向け 担当 桜井健次)に分かれて実施します。

定員 30名(実習A 6名、B 12名、C 12名)

申し込み方法 氏名(ふりがな)、所属、住所、TEL、FAX、e-mail、実習コース(A、B、C)のご希望をご連絡下さい。折り返し受付の連絡をいたします。

連絡先 国立研究開発法人 物質・材料研究機構
高輝度光解析グループ 桜井健次
TEL 029-859-2821 FAX 029-859-2801
e-mail SAKURAI.Kenji@nims.go.jp

